7.4　既制定JIS見直しに向けた検討

7.4.1　これまでの経緯

2017年度のJIS見直し調査にあたり，光能動部品部会関連25件の既制定JISの見直し依頼があった。また，2019年度には，新たに光能動部品部会関連6件の既制定JISの見直し依頼があった。

JISは定期的（5年ごと）に見直しが行われ，その都度，改正あるいは確認もしくは廃止の可否が検討されることから，2017年度対象の25件は，2013年10月に確認が行われたものであり，2019年度対象の6件は，2015年10月に確認が行われてきたものである。これらのJISについては，2013年及び2015年の見直し時点以降に対応国際規格や引用国際規格の改正や体系再編成，引用JISの改正や廃止等があったものが多数あった。この点について検討の結果，対象となったJISの技術的内容についての変更等は無く不変であるとの判断から，暫定的に確認としてきた。しかしながら，規格体系が変更になったり，部分的な改正や廃止があったりすることから，次回の見直しに向けて必要な部分の現行化を図り改正することが望ましいという結論となり，このための作業を2018年度からとりかかることが部会において合意されていた。

以下に，2018年度及び2019年度の作業内容について記す。なお，2018年度については，2018年度報告書の内容をそのまま転記したものである。

7.4.2　2018年度の検討作業

2018年度は前項の経緯を受け，第一歩として対象JISの見直し方針の検討と改正必要点の明確化に向けての作業を開始することとし，7.2.2項活動計画で述べたように，それぞれ担当者を表7.4.1のように決めて検討を進めることとした。

表7.4.1　既制定JIS見直し担当者

| No. | 規格番号 | 規格名称 | 担当者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JIS C 5940:1997 | 光伝送用半導体レーザ通則 | 吉田 |
| 2 | JIS C 5941:1997 | 光伝送用半導体レーザ測定方法 | 吉田 |
| 3 | JIS C 5950:1997 | 光伝送用発光ダイオード通則 | 吉田 |
| 4 | JIS C 5951:1997 | 光伝送用発光ダイオード測定方法 | 吉田 |
| 5 | JIS C 5952-1:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第１部：総則 | 磯野 |
| 6 | JIS C 5952-2:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第２部：ＭＴ-ＲＪ（Ｆ１９形）コネクタ付１０ピンＳＦＦ形光トランシーバ | 下小園 |
| 7 | JIS C 5952-3:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第３部：ＭＴ－ＲＪ（Ｆ１９形）コネクタ付２０ピンＳＦＦ形光トランシーバ | 下小園 |
| 8 | JIS C 5952-4:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第４部：ＰＮコネクタ付１×９ピンプラスチック光ファイバ光トランシーバ | 下小園 |
| 9 | JIS C 5952-5:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第５部：ＳＣ（Ｆ０４形）コネクタ付１×９ピン光送信・受信モジュール及び光トランシーバ | 下小園 |
| 10 | JIS C 5952-6:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第６部：ＡＴＭ－ＰＯＮ用光トランシーバ | 下小園 |
| 11 | JIS C 5952-7:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第７部：ＬＣコネクタ付１０ピンＳＦＦ形光トランシーバ | 下小園 |
| 12 | JIS C 5952-8:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第８部：ＬＣコネクタ付２０ピンＳＦＦ形光トランシーバ | 下小園 |
| 13 | JIS C 5952-9:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第９部：ＭＵ（Ｆ１４形）コネクタ付１０ピンＳＦＦ形光トランシーバ | 下小園 |
| 14 | JIS C 5952-10:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第１０部：ＭＵ（Ｆ１４形）コネクタ付２０ピンＳＦＦ形光トランシーバ | 下小園 |
| 15 | JIS C 5952-11:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第１１部：１４ピン変調器集積形半導体レーザ送信モジュール | 桑原 |
| 16 | JIS C 5952-12:2008 | 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第１２部：同軸形高周波コネクタ付半導体レーザ送信モジュール | 桑原 |
| 17 | JIS C 5953-4:2008 | 光伝送用能動部品―性能標準―第４部：1　３００ｎｍギガビットイーサネット用光トランシーバ | 津村 |
| 18 | JIS C 5953-5:2008 | 光伝送用能動部品―性能標準―第５部：半導体レーザ駆動回路及びクロックデータ再生回路内蔵ＡＴＭ－ＰＯＮ用光トランシーバ | 中村 |
| 19 | JIS C 5953-6:2009 | 光伝送用能動部品―性能標準―第６部：６５０ｎｍ，２５０Ｍｂｉｔ/ｓプラスチック光ファイバ伝送用光トランシーバ | 津村 |
| 20 | JIS C 5954-1:2008 | 光伝送用能動部品―試験及び測定方法―第１部：総則 | 中村 |
| 21 | JIS C 5954-2:2008 | 光伝送用能動部品―試験及び測定方法―第２部：試験及び測定方法―第2部：ATM-PON用光トランシーバ | 中村 |
| 22 | JIS C 5990:1997 | 光伝送用フォトダイオード通則 | 吉田 |
| 23 | JIS C 5991:1997 | 光伝送用フォトダイオード測定方法 | 吉田 |
| 24 | JIS C 6110:1997 | 低速光伝送リンク用送・受信モジュール通則 | 黒部 |

これまでの検討で明らかとなった見直し方針等の要約を，表7.4.2に示す。なお，詳細については，2018年度報告書7.4.2項から7.4.4を参照されたい。

これらの結果をもとに，今後さらに検討を進め，まだ方針等が明確でない部分について明確化を図るとともに，改正が必要な部分の具体的文章案を作成する作業にもとりかかる。

表7.4.2　既制定JIS見直し方針等の検討結果の要約

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 見直し対象規格番号 | 見直し方針等 | 備考 |
| C 5944, C 5941  C 5950, C 5951  C 5944, C 5945 | IECの規格体系の変更に沿い，「C 5940, C 5959, C 5944」，「5941, C 5951, C 5945」をそれぞれ一つのJISにまとめ，引用規格等の現行化を図るとともに「性能標準テンプレート」と「測定方法」とする。 | ・「通則」の名称を変更  ・今年度対象のC5944, C 5945も併せて検討 |
| C 5990, C 5991 | 引用規格等の現行化を図り，それぞれ「性能標準テンプレート」と「測定方法」とする。 | 「通則」の名称を変更 |
| C 5946, C 5947 | 引用規格等の現行化を図り，それぞれ「性能標準テンプレート」と「測定方法」とする。 | ・C5946, C 5947は今年度見直し対象であったが併せて検討  ・「通則」の名称を変更 |
| C 5953-4 | IEC改正とJIS廃止に伴う差異を修正した改正が必要。 |  |
| C-5953-6 | 廃止を検討する。 | 対応国際規格はすでに廃止 |
| C 5953-5 | 引用規格の現行化を図る。 |  |
| C 5954-1 | 改正の必要はないと思われる。 |  |
| C 5954-2 | 対応国際規格の変更点を確認する。 |  |
| C 6110 | C 6110の扱いはさらに検討を要する。 |  |
| C 6111 | 修正は軽微な内容とする。 |  |

7.4.3　2019年度の検討作業　（ここから新規）

　2019年度は，新たに以下の6件の既制定JISの見直し依頼があった。

1) JIS C 5942:2010「再生及び記録用半導体レーザ通則」

2) JIS C 5943:2010「再生及び記録用半導体レーザ測定方法」

3) JIS C 6114-1:2006「光変調器モジュール通則」

4) JIS C 6114-2:2006「光変調器モジュール測定方法」

5) JIS C 6115-1:2006「pin-FETモジュール通則」

6) JIS C 6115-2:2006「pin-FETモジュール測定方法」

これら6件のJISについて，対応国際規格及び引用JISの改廃などをまとめると，表7.4.3のようになっている。これに加え，技術的内容の見直しが必要か否かについても検討した結果，表7.4.4に示す方針に基づき，いずれも「暫定的確認」とするよう回答を行った。なお，これらの6件のJISについつては，前項（7.4.2）に記した2018年度の関連JISの見直しと合わせて，次回の見直しに間に合うように改正案作成の作業を進めることとした。

表7.4.3　2019年度見直し対象JISの対応国際規格及び引用JISの状況

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 見直し対象規格番号 | タイトル（略称） | 対応国際規格 | 存廃の現状 | 引用JIS | 改正等の現状 |
| C 5942:2010 | 再生記録用LD通則 | 60747-5-4:2006(MOD)  60747-5-2:1997(MOD) | 存続  廃止  （LD部分は60747-5-4にマージ"された） | C 0025:1988  その他の引用JISにも複数の廃止・改正あり | "廃止  C60068-2-14:2011" |
| C 5943:2010 | 再生記録用LD測定方法 | 60747-5-4:2006(MOD) | 存続 | C 1102-1 | C 1102-1:2007にAmandment 1:2011あり |
| C 6114-1:2006 | 光変調器 module通則 | 62007-1 Ed.1.1:1999 Ch.12 (MOD) | 改訂  (Ed.: 2009  Ed.3:2015)  アナログ関係デバイス削除に伴う改訂で，Ch.apter番号の変更のみ | 引用JISに複数の廃止・改正あり |  |
| C 6114-2:20016 | 光変調器 module測定方法 | 1）序文及び定義中のJIS番号の記述が間違っている（と思われる。JIS C 62007-1:20051 ⇒ JIS C 6114-1）  2) 対応国際規格（IEC 62007-2の一部のはず）の代わりに，通則(C 6114-1)を挙げているのは誤りと思われる | 改訂  (Ed.2:2005)  アナログ関係デバイス削除に伴う改訂で，光変調器に関する内容の変更は無し | 引用JISに複数の廃止・改正あり |  |
| C 6115-1:2006 | pinFET module通則 | 62007-1 Ed.1.1:1999 Ch.8 (MOD) | 改訂  (Ed.: 2009  Ed.3:2015)  アナログ関係デバイス削除に伴う改訂で，pinFETについては内容・Chapter.番号ともに変更無し | 引用JISに複数の廃止・改正あり |  |
| C 6115-2:2006 | pinFET module測定方法 | 62007-2 Ed.1.1:1999 (MOD) | 改訂  (Ed.2:2005)  アナログ関係デバイス削除に伴う改訂で，pin-FETについては変更無し | C 11021-1 | C 1102-1:2007にAmandment 1:2011あり |

表7.4.3　2019年度見直し対象JISの対応方針検討結果

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 見直し対象規格番号 | 見直し方針等 | 備考 |
| C 5942:2010 | 対応国際規格IEC 60747-5-2:1997は廃止され，レーザ関係はIEC 60747-5-4：2006にマージされた。また，,引用JISの一部に改正・廃止があったが，技術的内容には変更は無い。改正原案作成を開始することとしているが，市場の混乱を避ける必要があり関連するJISと同時に改正するため改正申出予定時期が再来年度以降となることから，暫定的確認を要請する。 | 「通則」の名称変更の検討必要あり |
| C 5943:2010 | 対応国際規格IEC 60747-5-4:2006は存続。引用JISに改正があったが技術的内容には変更がない。改正原案作成を開始することとしているが，市場の混乱を避ける必要があり関連するJISと同時に改正するため改正申出予定時期が再来年度以降となることから，暫定的確認を要請する。 |  |
| C 6114-1:2006 | 対応国際規格IEC 62007-1:1999に改訂があったが，アナログ信号対応部品に関する部分のみで本JISに関する部分の改訂は無い。また，引用JISの一部が改正・廃止されているが技術的内容には変更が無い。改正原案作成を開始することとしているが，市場の混乱を避ける必要があり関連するJISと同時に改正するため改正申出予定時期が再来年度以降となることから，暫定的確認を要請する。 | 「通則」の名称変更の検討必要あり |
| C 6114-2:20016 | 引用JIS規格の一部が改正されたが，技術内容は変更がなく，改正原案作成を開始することとしているが，市場の混乱を避ける必要があり関連するJISと同時に改正するため改正申出予定時期が再来年度以降となることから，暫定的確認を要請する。 |  |
| C 6115-1:2006 | 対応国際規格IEC 62007-1:1999に改訂があったが，アナログ信号対応部品に関する部分のみで本JISに関する部分の改訂は無い。また，引用JISの一部が改正・廃止されているが技術的内容には変更が無い。改正原案作成を開始することとしているが，市場の混乱を避ける必要があり関連するJISと同時に改正するため改正申出予定時期が再来年度以降となることから，暫定的確認を要請する。 | 「通則」の名称変更の検討必要あり |
| C 6115-2:2006 | 対応国際規格IEC 62007-2:1999は改訂されているが，アナログ信号対応部品に関する部分のみで本JISに関する部分の改訂は無い。引用JISが改正されているが技術的内容には変更が無い。市場の混乱を避ける必要があり関連するJISと同時に改正するため改正原案作成を開始することとしているが，改正申出予定時期が再来年度以降となることから，暫定的確認を要請する。 |  |